

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-139513

(43)Date of publication of application : 17.05.2002

(51)Int.Cl.

G01R 1/067
G01R 1/06
G01R 1/073
G01R 31/26
H01L 21/66

(21)Application number : 2000-336428

(71)Applicant : NHK SPRING CO LTD

(22)Date of filing : 02.11.2000

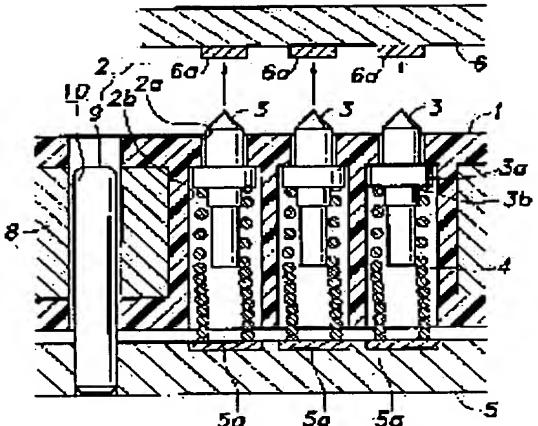
(72)Inventor : KAZAMA TOSHIO

(54) CONTACT PROBE UNIT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To facilitate exchange or repair of a contact probe unit.

SOLUTION: A conductive needle-like body 3 and a coil spring 4 are provided in a holder hole 2 made in a support body 1, a pin 9 is protruded from a circuit board 5 having a terminal 5a in contact with the coil spring 4, the support body 1 is held in a displaceable manner by a through-hole 10 made in the support body and the pin, and the conductive needle-like body is brought into contact with an electrode 6a of a wafer 6 for inspection. Both members can be positioned without being integrated with each other by adhesive or the like, and can be easily separated during the maintenance, and a conductive contact can be easily exchanged, and a plate-like body can be easily repaired.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-139513

(P2002-139513A)

(43)公開日 平成14年5月17日(2002.5.17)

(51)Int.Cl'	識別記号	F I	マーク(参考)
G 0 1 R	1/067	G 0 1 R	C 2 G 0 0 3
	1/06		D 2 G 0 1 1
	1/073		D 4 M 1 0 6
	31/26	31/26	J H

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 10 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号	特願2000-336428(P2000-336428)	(71)出願人 000004640 日本発条株式会社 神奈川県横浜市金沢区桜木3丁目10番地
(22)出願日	平成12年11月2日(2000.11.2)	(72)発明者 風間 俊男 長野県上伊那郡宮田村313番地 日本発条 株式会社内

(73)代理人 100089266 弁理士 大島 噶一 F ターム(参考) 20003 AA10 AC01 AC03 AQ08 AH04 20011 AA09 AB01 AB04 AB06 AB07 AC05 AC14 AE03 AF07 4U108 AA01 BA01 BA14 CA60 DE04 DD09 DD10 DD18

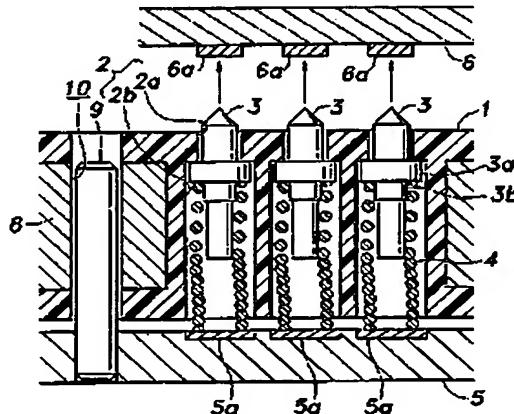
(54)【発明の名称】 コンタクトプローブユニット

(57)【要約】

【課題】 コンタクトプローブユニットにおける交換や
補修を容易にする。

【解決手段】 支持体1に設けたホルダ孔2内に導電性
針状体3及びコイルばね4を設け、コイルばね4と接触
させる端子5aを有する配線板5にピン9を突設し、支
持体に設けた貫通孔10とピントにより支持体を変位可
能にし、導電性針状体をウェハ6の電極6aに接触させ
て検査を行う。

【効果】 両者を接着材などで一体化しないで位置台わ
せることができ、メンテナンス時に両者の分離が簡単
であり、導電性接觸子の交換や板状体の補修などを容易
に行うことができる。



(2) 特開2002-139513

2

あっては、特にそのランニングコストが重要になる。

【0003】また、バーンインテストでは例えば125～150度の高温雰囲気が数十時間持続されるため、導電性接触子ユニットにあっては耐熱性や低熱膨張率が重要な要素となる。また、ウェハの材料となるシリコンと同程度の耐熱性や低熱膨張率を有する材料として、シリコンを含めて例えばセラミックスやガラスあるいはインバーなどの低熱膨張金属があるが、シリコンにあっては加工速度が遅いばかりでなく精密加工が必要であり、セラミックスは難削材であり、ガラスにあっては加工精度のはらつきが大きいため歩留まりが悪く、低熱膨張金属は難削材かつ絶縁加工を必要とする。そのため、支持体にこれらの材質のものを使用して多数の精密孔を加工した場合には、生産性が極めて低く、生産コストが高騰化するという問題があった。

【0004】支持体の材質としては精密加工が容易な合成樹脂などが好適であるが、板状支持体に多数の導電性接触子を高密度に配設したコンタクトプローブユニットにあっては、多数の導電性接触子による集中した圧力により支持体が反るおそれがあり、また熱膨張により導電性接触子（導電性針状体）の位置がずれるおそれもあり、そのような場合には接点がずれてしまうという問題がある。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】また、ウェハ・レベルでのバーンインテスト（WLB I）を行う場合、例えば、直徑8インチ（約20cm）のように大径ウェハにあっては、支持体を載せるように重ね合わされた配線板の内部溝が密であり、支持体の配線板への固定は接着材で行っていた。したがって、1枚で構成されている支持体の場合には、その内部の導電性接触子を交換したり、支持体の補修や交換をしたりすることができないという問題があった。

【0006】

【課題を解決するための手段】このような課題を解決して、コンタクトプローブユニットにおける交換や補修を容易にするために、本発明に於いては、被接触体に接触させる複数の導電性接触子を並列に配設した状態で支持するための支持体と、前記複数の導電性接触子と電気的に接続されるように前記支持体に重ね合わされた配線板とを有するコンタクトプローブユニットであって、前記支持体が、前記配線板と前記支持体のいずれか一方に突設されかつ他方に挿入されたピンにより変位可能にガイドされているものとした。

【0007】これによれば、支持体と配線板とがピンを介して変位可能に組み付けられることから、メンテナンス時に両者の分離が簡単であり、導電性接触子の交換や板状体の補修などを容易に行うことができる。

【0008】特に、前記支持体が、複数の板状体を網羅して形成されていることによれば、複数の板状体を分離

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】被接触体に接触させる複数の導電性接触子を並列に配設した状態で支持するための支持体と、前記複数の導電性接触子と電気的に接続されるように前記支持体に重ね合わされた配線板とを有するコンタクトプローブユニットであって。

前記支持体が、前記配線板と前記支持体のいずれか一方に突設されかつ他方に挿入されたピンにより変位可能にガイドされていることを特徴とするコンタクトプローブユニット。

【請求項2】前記支持体が、複数の板状体を積層して形成されていることを特徴とする請求項1に記載のコンタクトプローブユニット。

【請求項3】被接触体に接触させる複数の導電性接触子を並列に配設した状態で支持するためのプロックと、前記プロックを着脱可能に支持するプロック支持体とを有することを特徴とするコンタクトプローブユニット。

【請求項4】前記プロック支持体に前記プロックを受容し得る段付き孔を設け、前記プロックに前記段付き孔の段部に係合する肩部を設けたことを特徴とする請求項3に記載のコンタクトプローブユニット。

【請求項5】前記プロック支持体が、複数の板状体を積層して形成されていることを特徴とする請求項3若しくは請求項4に記載のコンタクトプローブユニット。

【請求項6】被接触体に接触させる複数の導電性接触子を並列に配設した状態で支持するための支持体を有するコンタクトプローブユニットであって、前記支持体が複数の板状体を積層して形成されていると共に、前記複数の板状体の少なくとも一方の最外層板状体に補強材が一体化されており、前記複数の板状体が、前記一方の最外層板状体の前記補強材にねじ込まれたねじにより、互いに一体的に結合されていることを特徴とするコンタクトプローブユニット。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体開通部品の検査工程で使用されるコンタクトプローブユニットにおいて、特にバーンインテストに適するコンタクトプローブユニットに関するものである。

【0002】

【従来の技術】近年、半導体開通部品の検査において、高温雰囲気（約150度）下で圧力を印加して長時間（数時間～数十時間）テストするバーンインテストが行われているが、パッケージ・レベルでのバーンインテストでは歩留まりが悪く、ウェハ・レベル（例えば直徑200mmのウェハ）でのバーンインテストの実施により歩留まりを高めることが要求されるようになってきた。したがって、ウェハ・レベルのバーンインテストに使用される多点同時測定用のコンタクトプローブユニットに

(3)

特開2002-139513

4

3
することができるため、例えば導電性接触子の抜け止め用の最外層の板状体のみを分離するのみで導電性接触子の交換が可能になり、より一層メンテナンスなどを容易に行うことができる。

【0009】あるいは、板接触体に接触させる複数の導電性接触子を並列に配設した状態で支持するためのブロックと、前記ブロックを着脱可能に支持するブロック支持体とを有するものとした。これによれば、導電性接触子の交換などをブロック毎に行うことができるため、メンテナンス作業が容易になるばかりでなく、制作時にも、一部に加工不良が生じてもその一部のみを交換すれば良く、また全ブロックを同時に加工することにより制作時間を短縮できる。

【0010】特に、前記ブロック支持体に前記ブロックを受容し得る段付き孔を設け、前記ブロックに前記段付き孔の段部に係合する肩部を設けることにより、簡単な形状でブロックの抜け止めを行うことができると共に、分離も容易である。

【0011】さらに、前記ブロック支持体が、複数の板状体を積層して形成されていることによれば、複数の板状体を分離することができるので、例えば段付き孔の段部を設けられた板状体のみを分離するのみでブロックの交換が可能になり、より一層メンテナンスなどを容易に行うことができる。

【0012】あるいは、板接触体に接触させる複数の導電性接触子を並列に配設した状態で支持するための支持体を有するコンタクトプローブユニットであって、前記支持体が複数の板状体を積層して形成されていると共に、前記複数の板状体の少なくとも一方の最外層板状体に補強材が一体化されており、前記複数の板状体が、前記一方の最外層板状体の前記補強材のいずれか一方にねじ込まれたねじにより、互いに一体的に結合されているものとした。

【0013】これによれば、複数の板状体同士が板状体に一体化した補強材にねじ込まれたねじにより互いに一体的に結合されることから、導電性接触子のホルダ孔を形成する部分を合成樹脂などの加工容易な材質とすることができ、導電性接触子の高密度化に対応し得ると共に、補強材により支持体の強度が上がることから例えば大径ウェハに好適であり、また、ねじを外すことにより容易に板状体を分離することができるため、導電性接触子の交換や板状体の補修などを容易に行うことができる。

【0014】

【発明の実施の形態】以下に添付の図面に示された具体例に基づいて本発明の実施の形態について詳細に説明する。

【0015】図1は、本発明が適用されたコンタクトプローブユニットの一部を示す側断面図である。この導電性接触子ユニットは、ウェハ・レベルのバーンインテス

トの使用に適する多点同時測定可能なものである。図1にあっては、その支持体1に厚さ方向に貫通する段付き孔形状のホルダ孔2が形成されて、そのホルダ孔2の小径孔2aにより導電性針状体3が出没自在に受容され、その大径孔2bにコイルばね4が受容されている。

【0016】図2は導電性接触子用支持体1の平面図であり、図では、支持体1に組み合わされる導電性針状体及びコイルばねの図示を省略している。検査対象が例えば8インチ・ウェハの場合には、本支持体1の大きさは、直径8インチ(約20.0mm)前後の図に示されるような円形板状であって良い。また8インチ・ウェハの場合には、その面積の中に數十個～数百個の半導体チップが形成されている。さらに、12インチ・ウェハの場合には数千個の半導体チップが形成されている。

【0017】なほ、図2に示されるように、各ホルダ孔2はチップ単位に集まっており、それら集台部分毎に外周する開口を有しかつ支持体1の外周面近傍に至る全体として円板形状をなす補強材8が支持体1内に例えば埋設されて一体化されている。補強材3にインバーやコバルなどの耐熱性を有する低熱膨張金属をエッティングやレーザー、プレスあるいは他の機械加工によりチップ単位の開口8aを複数有するプレート状に形成したもの用い、その補強材8をインサートモールドにより合成樹脂材に埋設している。または別個に加工した合成樹脂材にその加工後に補強材を固定しても良く、そのようにして補強材8を一体化してなる支持体1が形成されている。

【0018】したがって、ホルダ孔2を設ける部分である上記開口8aには合成樹脂材が埋められていることからホルダ孔2を容易かつ精密に加工することができると共に、補強材8により支持体1の熱変形が防止される。

【0019】このようにして構成された導電性接触子における導電性針状体3は、大径孔2b内に受容された外向フランジ部3aを有し、さらに大径孔2b内導電性針状体3の外向フランジ部3aから延出する端部3bの根本側の大径部に一方のコイル端部が巻き付けられたコイルばね4により彈発力が得られている。なお、コイルばね4の他方のコイル端部は、支持体1に積層された配線板5の各端子5aに弾発的に接触している。これらの端子5aは図示されないテスターの電気回路に接続されている。

【0020】また、支持体1の図における下方に設けられた配線板5に支持体1側に向けて突出するピン9が埋設されている。支持体1にはピン9に対応する位置に貫通孔10が設けられており、ピン9を貫通孔10に挿入するようにして支持体1と配線板5とが互いに重ね合せた状態に組み付けられている。このようにして、支持体1が、配線板5に対してピン9によりガイドされつつ接觸するように変位可能にされている。なお、ピン9と

(4)

特開2002-139513

5

貫通孔10との間にあっては、図では強調して示されており、複数可能な程度であって導電性針状体3の位置決め公差を考慮して設定される。また、配線板5にピン9を配置するスペースを考慮しなければならないが、最小直径を1~2mm程度にしたピン9を、図2に示されるように最低2本配置できれば良い。

【0021】なお、この状態にあっては、ホルダ孔2の小径孔2aと大径孔2bとの間の肩部に外向フランジ部3aが当接することから、コイルばね4の彈発力により配線板5に対して支持体1が浮いた状態になるが、導電性針状体3の針先を上に向けて検査対象となるウェハ6の電極6aに接触させる場合には何ら問題がない。そして検査を行う際には、支持体1をウェハ6に接近させることにより、導電性針状体3が電極6aに接触し、さらに接近させて支持体1の下面に配線板5を当接させることにより、図3に示されるように、コイルばね4による所定の圧縮変形量による所定の彈発付勢力をもって導電性針状体3を電極6aに接触させて、電気的検査を実施する。このとき、図1に示される検査前の状態において、軸部3bの根元側の大径部よりも若干小径にされた小径部にコイルばね4の密着巻き部が接触しており、その状態からコイルばね4が圧縮されるため、検査時には、コイルばね4を通る電流が常に密着巻き部を密着方向である船波方向に流れることができ、コイルばね4における導通抵抗を好適に最小限に抑えることができる。

【0022】なお、ウェハ6の上部を図示されない押さえ部材により押さえるようにして、ウェハ6の支持体1に対する間隔が調整されている。また、配線板5に対して支持体1が浮いた状態に組み付けられることにより、導電性針状体3のストロークを大きく取ることができ、各電極6a間の凹凸が大きい場合であってもその偏差を好適に吸収でき、導電性針状体3を電極6aに確実に接触させることができる。

【0023】このように構成されたコンタクトプローブユニットにあっては、支持体1と配線板5とを互いに離反させることができ、図とは上下逆になるように支持体1を下にして配線板5を取り除くことにより、導電性針状体3及びコイルばね4をホルダ孔2から引き上げて取り出すことができる。したがって、導電性針状体3の交換や、支持体1の補修または交換などを容易に行うことができる。

【0024】次に、図4及び図5を参照して本発明に基づく第2の例を示す。なお、図4は図1に対応し、図5は図3に対応しており、図において前記図示例と同様の部分については同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。

【0025】この第2の例にあっては、支持体1が2枚の板状体1a・1bを重ね合わせて構成されているものであり、例えば図示されないねじにより互いにねじ結合されて一体化されている。そして、上記した例と同様

に、配線板5に植設したピン9と、支持体1に設けた貫通孔10とにより、支持体1と配線板5とが互いに相対的に変位可能に組み付けられている。

【0026】この場合には、前記と同様の作用・効果を有すると共に、上側の板状体1aのみを取り外すことができるので、導電性針状体3の交換作業を、支持体1を図の状態のままで上方からアクセスして行うことができる。メンテナンス性が良い。また、組み立て性も良い。

【0027】これら第1及び第2の例にあっては、ピン9によりガイドされる貫通孔10が補強材3に形成されており、このようにすることにより、その孔明けを高精度化することができるため、高密度化されたものに好適である。

【0028】また、図6に本発明に基づく第3の例を示す。なお、図6は図4に対応しており、図において上記図示例と同様の部分については同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。

【0029】この第3の例にあっては、第2の例と同様に2枚の板状体11a・11bを重ね合わせてブロック支持体11が構成されている。また、図2に示される導電性接觸子の集合部分毎に別部材からなるブロック13が設けられている。図6に示されるように、ブロック13は、ブロック支持体11の厚さと同一の厚さにて補強材8の開口8a内に受容される大きさに形成されていると共に、図において上側に凸状をなすように形成されている。また、両板状体11a・11bには、ブロック13に対して複雑的形状をなす段付き孔12が前記開口8a毎に設けられている。そして、各板状体11a・11b同士が、ブロック支持体11の通所にて両板状体11a・11bを厚さ方向に貫通するようにねじ込まれた結合部材としての組み付けねじ7により、互いに密接状態に一体化されている。図において、上側の板状体11aには、その補強材8に組み付けねじ7用のねじ通孔11cが設けられており、図の下側の板状体11bには、その補強材8に組み付けねじ7用のねじ孔11dが設けられている。

【0030】ブロック13には、前記と同様のホルダ孔2が導電性接觸子の数に応じて設けられており、各ホルダ孔2に導電性針状体3及びコイルばね4が受容されている。また、図7に示されるように、上側の板状体11aに段付き孔12の段部12aが形成されていると共に、ブロック13には上記したように凸状形状による肩部13aが形成されており、組み立て状態で段部12aに肩部13aが係合して、ブロック支持体11によりブロック13が図における上方に対して抜け止めされる。

【0031】組み立てにあっては、図7に示されるように、上側の板状体11aの段付き孔12に対して下方からブロック13を持入するようにし、下側の板状体11bを上側の板状体11aに重ね合わせて、ブロック支持体11及びブロック13を一体化する。さらに、図8に

(5)

特開2002-139513

8

7

示されるように、導電性針状体3にコイルばね4を一体化したものを、ブロック13のホルダ孔2に挿入する。そして、配線板5をブロック支持体11に前記したように接着またははめ合いで組み付ける。これにより、ブロック支持体11の下方に対してもブロック13が抜け止められる。

【0032】この第3の例にあっては、上側の板状体11aを取り外すことにより、導電性接触子をブロック13毎に取り扱うことが可能である。例えば1枚の支持体に5000個のホルダ孔を明ける場合には、その途中(例えば4500個目)で加工不良が生じるとそれまでに加工した部分も含めて全て無駄になってしまう。それに対して、この第4の例によれば、例えば200個のホルダ孔を設けたブロック13を25個用意することにより上記と同じ5000個のホルダ孔を設けることができる。加工不良が生じた場合にはその1ブロック(200個のホルダ孔)のみを交換すれば良く、制作コストを削減し得る。

【0033】また、各ブロック13に対する孔明け作業を、上記例では25個のブロック13に対して同時にを行うことができ、納期短縮が可能となる。またメンテナンスにおいても、1ブロック13毎に交換可能であることからメンテナンス性が向上する。なお、ブロック13を、金型により成形しても、機械加工しても良いが、特に、高密度化に対応させるべく高精度加工が可能な合成樹脂成形であると良い。さらに、この合成樹脂成形によればコスト削減の効果をも奏し得る。

【0034】次に、図9及び図10を参照して本発明に基づく第4の例を示す。なお、図9は図4に対応し、図10は図2に対応しており、図において上記図示例と同様の部分については同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。また、使用状態を示す図5に対応する図は図示省略する。

【0035】この第4の例にあっても、2枚の板状体1a・1bを互いに重ね合わせて支持体1が形成されている。また、各板状体1a・1b内には補強材8がそれぞれ埋設されている。そして、各板状体1a・1b同士が、図9及び図10に示されるように支持体1の適所にて両板状体1a・1bを厚さ方向に貫通するようにねじ込まれた結合部材としての組み付けねじ7により、互いに密着状態に一体化されている。なお、図10ではねじを4本用いたが、前記した例のピン9と同様に2本であっても良い。

【0036】図における上側の板状体1aには、その補強材8に組み付けねじ7用のねじ掉落孔1cが設けられており、図の下側の板状体1bには、その補強材8に組み付けねじ7用のねじ孔1dが設けられている。このように、各板状体1a・1b内の各補強材8を利用してねじ結合することにより、板状体1a・1b同士を互いに強固に一体的に結合することができる。なお、配線板5

の支持体1(板状体1b)の図における下面への接合は、接着やはめ合いなどであって良い。

【0037】このようにして構成されたコンタクトプローブユニットにあって各部品の交換や補修を行う際には、組み付けねじ7を締めて取り外すことにより、各板状体1a・1bを分割することができ、それにより、導電性針状体3及びコイルばね4が露出し得る。したがって、導電性針状体3の交換や、支持体1の補修または交換が可能であり、本製品の性能維持や検査コストの削減の効果を奏し得る。

【0038】上記各例にあっては、コイルばね4の一端部にのみ導電性針状体3を設けた導電性針状子について示したが、本発明が適用されるコンタクトプローブにあっては、コイルばねの両端部に導電性針状体を設けた両端可動型であっても良く、その一例を第5の例として、図11を参照して以下に示す。なお、図11は図4に対応する図であり、図において上記図示例と同様の部分については同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。また、使用状態を示す図5に対応する図は図示省略する。

【0039】この第5の例にあっては、2枚の板状体1a・1bを互いに重ね合わせて支持体1が形成されており、これら各板状体1a・1bの構造及び組み付け方にあっては上記第4の例と同様であって良く、補強板8やピン9などの図示が省略されている。図に示されるように、下側の板状体1bには、上側の板状体1aと対称的に、小径孔2a及び大径孔2bが設けられている。また、コイルばね4が、上側板状体1aに対応する部分が密着巻きにされ、下側板状体1bに対応する部分が粗巻きにされている。

【0040】コイルばね4の両端部に上記図示例と同様の導電性針状体3・14がそれぞれ取り付けられていると共に、各導電性針状体3・14の各外向フランジ部3a・14aが上記図示例と同様に大径孔2b内に受容されている。したがって、図に示されるように支持体1に両導電性針状体3・14が受容された状態では、各外向フランジ部3a・14aがホルダ孔2の小径孔2aと大径孔2bとの間の各肩部にそれぞれ当接しており、そのようにして両導電性針状体3・14が抜け止めされている。

【0041】なお、コイルばね4の密着巻き側に取り付けられた導電性針状体3の軸部3bの根本側の大径部よりも若干小径にされた小径部は比較的短い軸長にて形成されており、粗巻き側に取り付けられた導電性針状体14の軸部14bの小径部は比較的長い軸長にて形成されている。これは、前記した図1の例と同様に検査時にコイルばね4の軸線方向に電流を流してコイルばね4における導通抵抗を好適に最小限に抑えるべく、図における初期状態(検査前の状態)において、下側の導電性針状体14の軸部14aがコイルばね4の密着巻き部と接触

(6)

特開2002-139513

9

し得るようにするためである。

【0042】このようにして、コイルばね4の両端部に導電性針状体を有する両端可動型のコンタクトプローブが構成されており、この図示例にあっても、各部品の交換や補修を行う際には、組み付けねじ7を締めて取り外すことにより、各板状体1a・1bを分割することができ、それにより、導電性針状体3・14及びコイルばね4を取り出すことができる。したがって、導電性針状体3・14の交換や、支持体1の補修または交換が可能であり、本製品の性能維持や検査コストの削減の効果を奏し得る。

【0043】また、第5の例と同様の両端可動型の他の例として、第6の例を、図12を参照して以下に示す。なお、図12は図1に基づく図1-1に対応する図である。図において上記各図示例と同様の部分については同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。また、使用状態を示す図3に対応する図は図示省略する。

【0044】この第6の例にあっては、図1と同様に1枚の板状体からなる支持体1に設けたホルダ孔2内に、上記図1と同様の一対の導電性針状体3・14及びコイルばね4を受容したものである。したがって、ホルダ孔2の図における下端部は、大径孔2bのままのストレート孔として形成されている。

【0045】この第6の例の場合には、図1の例と同様に、支持体1と配線板5とを互いに離反させることができ、図とは上下逆になるように支持体1を下にして配線板5を取り除くことにより、導電性針状体3及びコイルばね4をホルダ孔2から引き上げて取り出すことができる。したがって、導電性針状体3の交換や、支持体1の補修または交換などを容易に行うことができる。

【0046】なお、上記各図示例において複数の板状体の例として2枚構造としたが、2枚に限定されるものではなく、互いに積層される板状体を3枚以上としても良い。また、上記各図示例では支持体の適所に補強材を設けた構造について示したが、高精度化や熱変形をそれ程要求されないものにあっては、補強材を設けない合成樹脂製の支持体を用い、その支持体に孔を開けるようにしても良く、この場合にあっても上記と同様のメンテナンス性を有することができる。

【0047】

【発明の効果】このように本発明によれば、支持体と配線板とがピンを介して変位可能に組み付けられていることから、支持体と配線板とをピン結合により互ね合わせた状態にすることにより、两者を接着材などで一体化しないで位置合わせすることができ、メンテナンス時に両者の分離が簡単であり、導電性接觸子の交換や板状体の補修などを容易に行うことができる。特に、複数の板状体を積層して支持体を形成することにより、複数の板状体を分離することができるため、例えば導電性接觸子の抜け止め用の最外層の板状体のみを分離するのみで導電

10

性接觸子の交換が可能になり、メンテナンスなどをより一層容易に行うことができる。また、支持体と配線板とが変位可能なため、支持体に組み込まれた接觸子のはね力の支持体への負荷を小さくできるので、はね力による支持体の反りを最小限にすることも可能になる。

【0048】あるいは、導電性接觸子を設けたブロックをブロック支持体により若脱可能に支持することにより、導電性接觸子の交換などをブロック毎に行うことができるため、メンテナンス作業が容易になるばかりでなく、ブロックを樹脂成形化することにより、制作時に一部に加工不良が生じてもその一部のみを交換すれば良いためコストを削減できると共に、全ブロックを同時に加工することにより製造時間を短縮でき、納期短縮が可能である。

【0049】特に、ブロック支持体の段付き孔とブロックの肩部とにより、簡単な形状でブロックの抜け止めを行ふことができると共に、分離も容易になり、さらに、ブロック支持体を複数の板状体を積層して形成することにより、例えば段付き孔の段部を設けられた板状体のみを分離するのみでブロックの交換が可能になり、より一層メンテナンスなどを容易に行うことができる。

【0050】特に、板状体に補強材を一体化して反りなどを防止することにより、ウェハ・レベルでのバーンインテストに好適であり、導電性接觸子を設ける部分を加工容易な合成樹脂などにすることにより導電性接觸子の高密度化に対応できると共に、その補強材を利用してねじ結合することにより、複数の板状体を分割することができるため、導電性接觸子の交換や板状体の補修などを容易に行うことができる。

30 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明が適用されたコンタクトプローブユニットの一部を示す側断面図。

【図2】導電性接觸子用支持体の平面図。

【図3】検査状態を示す図1に対応する図。

【図4】第2の例を示す図1に対応する図。

【図5】第2の例における検査状態を示す図3に対応する図。

【図6】第3の例を示す図4に対応する図。

【図7】第3の例における分解組み立て要領を示す要部40 破断側面図。

【図8】第3の例におけるブロック支持体を示す要部破断側面図。

【図9】第4の例を示す図4に対応する図。

【図10】第4の例における図2に対応する図。

【図11】第5の例を示す図4に対応する図。

【図12】第6の例を示す図1-1に対応する図。

【符号の説明】

1 支持体、1a・1b 板状体、1c ねじ通孔、
1d ねじ孔

50 2 ホルダ孔、2a 小径孔、2b 大径孔

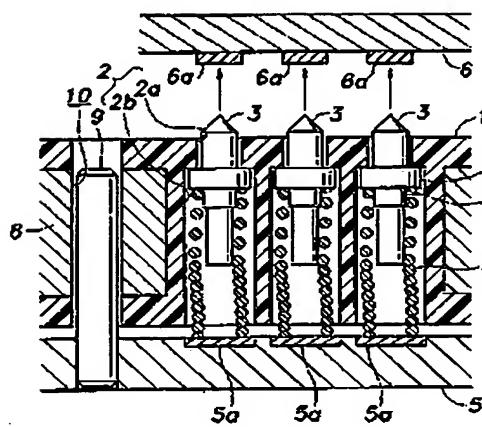
(7)

特開2002-139513

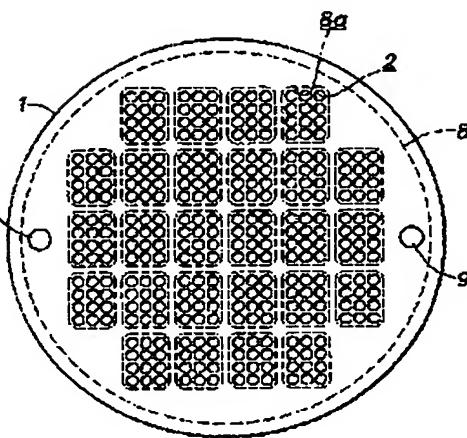
12

- | | |
|---|--|
| 3 導電性針状体、3a 外向フランジ部、3b 軸部
4 コイルばね
5 配線板、5a 電子
6 ウェハ、6a 延極
7 組み付けねじ
8 植強材、8a 開口
9 ピン | * 10 貢通孔
11 ブロック支持体、11a・11b 板状体
12 段付き孔、12a 段部
13 ブロック
14 導電性針状体、14a 外向フランジ部、14b 軸部
* |
|---|--|

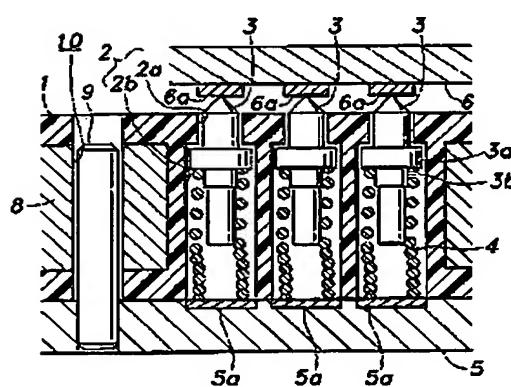
【図1】



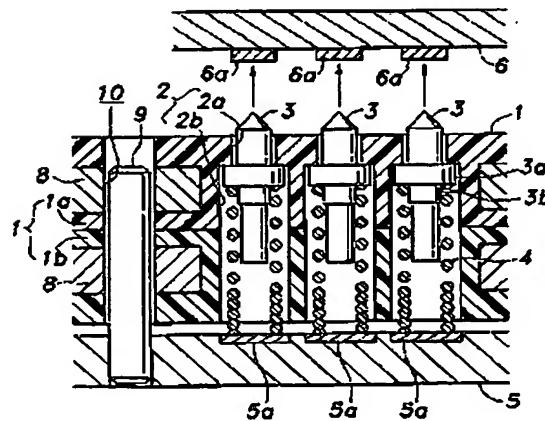
【図2】



【図3】



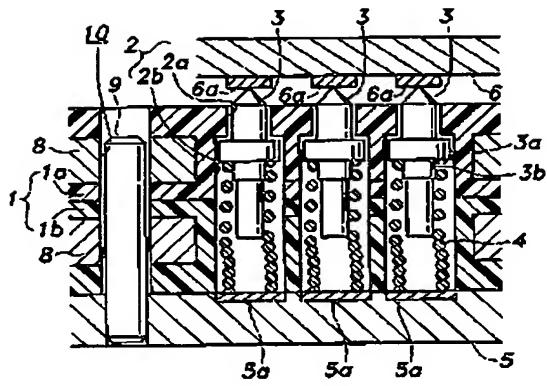
【図4】



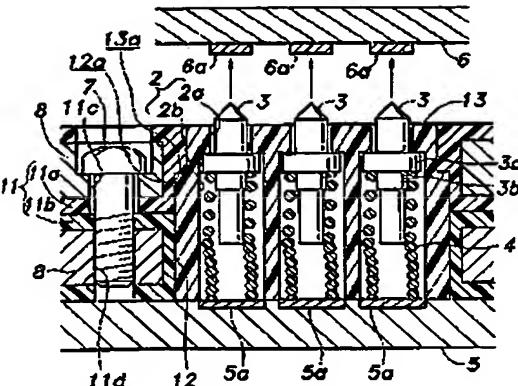
(8)

特開2002-139513

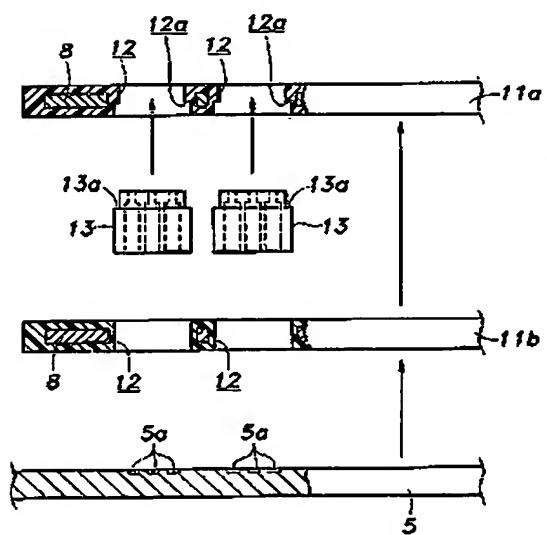
[図5]



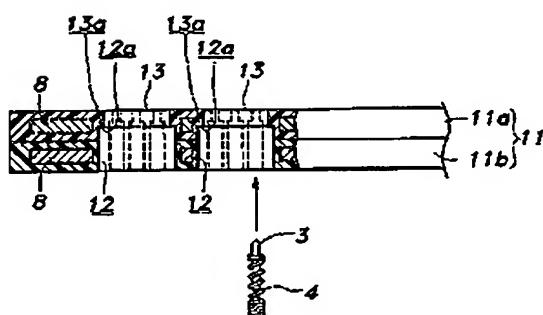
[図6]



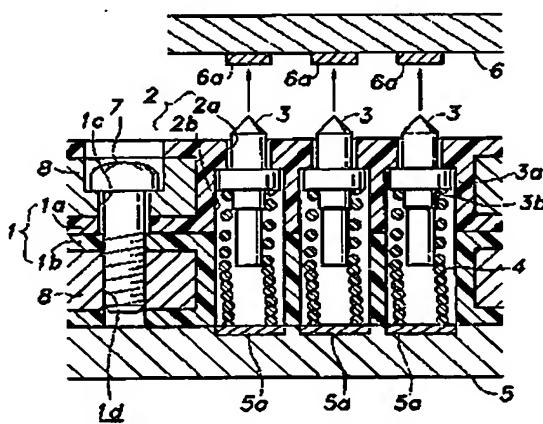
[図7]



[図8]



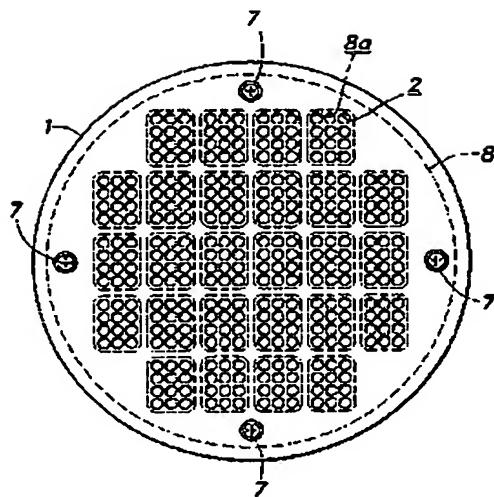
[図9]



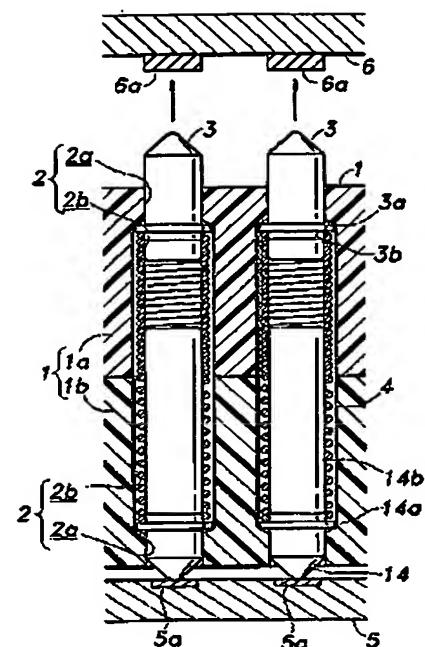
(9)

特開2002-139513

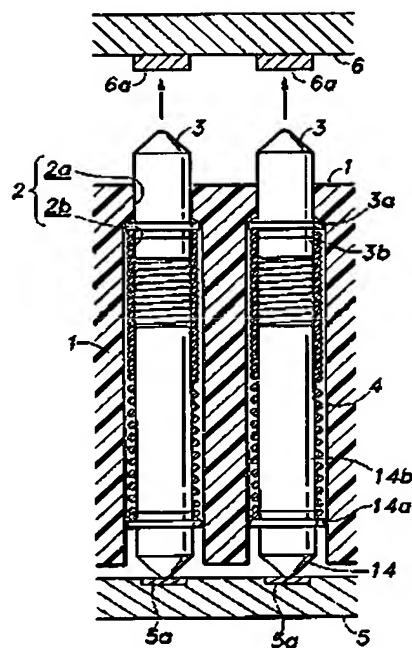
【図10】



【図11】



【図12】



(10)

特開2002-139513

フロントページの続き

(51)Int.Cl.
H01L 21/66

識別記号

F I
H01L 21/66

マーク(参考)
H
B